

# NAIST<sup>®</sup>

## ナノテクプラットフォーム

### NAIST ナノテクノロジープラットフォーム 利用料金表

技術代行	機器利用	協力研究	技術相談
専門知識を持つ教員または技術職員が測定／解析を行います。	利用者が自ら装置を使用し、測定／解析を行います。	研究開発の進捗に応じて3ヶ月間（1期）、技術代行及び機器利用のどちらでも、また組み合わせて利用可能です。	受託の可否判断（利用相談）を越える技術的相談

2020年10月

業 務	共用設備 (メーカー名、型番)	利用料(円) (消費税を除く)			課金単位 (※6)
		学術研究機関	中小企業	大企業	
技術代行 (※1)	300kV透過電子顕微鏡(300kV-TEM) (JEOL JEM-3100FEF)	37,500	75,000	112,500	1検体
	200kV透過電子顕微鏡(200kV-TEM) (JEOL JEM-2200FS)	14,400	28,800	43,200	1検体
	走査透過電子顕微鏡(STEM) (HITACHI HD-2700)	46,800	93,500	140,300	1検体
	超高分解能電界放出型電子顕微鏡(FE-SEM) (HITACHI SU9000)	13,700	27,400	41,100	1検体
	低真空分析走査電子顕微鏡 (HITACHI SU6600)	9,700	19,400	29,100	1検体
	微小デバイス特性評価装置(nanoEBAC) (HITACHI NE4000)	67,500	135,000	202,500	1検体
	走査プローブ顕微鏡(SPM) (HITACHI SPA400)	2,700	5,300	8,000	1検体
	二重収束型質量分析計(Sector-MS) (JEOL JMS-700 MStation)				
	LC/TOF-MS (JEOL JMS-T100LC AccuTOF)				
	MALDI-TOF-MS (Bruker autoflexII)	2,000	4,000	6,000	1検体
	MALDI-Spiral-TOF-MS (JEOL JMS-S3000)				
	X線構造解析装置 (Rigaku SmartLab9kW/IP/HY/N)	5,000	10,000	15,000	1検体
	微小結晶X線構造解析装置 (Rigaku VariMax RAPID RA-Micro7)	27,300	54,500	81,800	1検体
	高輝度X線発生装置 (Rigaku NanoViewer)	21,000	42,000	63,000	1検体
	600MHz超伝導NMR (JEOL JNM-ECA600)	1,300 [7,800]	2,600 [15,600]	3,900 [23,400]	
	500MHz超伝導NMR (JEOL JNM-ECX500)				1検体
	400MHz固体超伝導NMR(※4) (JEOL JNM-ECX400P)	1,000 [6,000]	2,000 [12,000]	2,900 [17,400]	[ ]は H以外の核種
	電子スピン共鳴装置(ESR) (JEOL JES-FA100N)	2,400	4,800	7,200	1検体
	電子線マイクロアナライザ(EPMA) (SHIMADZU EPMA1610)	15,000	30,000	45,000	1検体
	二次イオン質量分析装置(SIMS) (ULVAC-PHI ADEPT-1010)	8,900	17,700	26,600	1検体
	多機能走査型X線光電子分光分析装置(XPS) (ULVAC-PHI PHI5000VersaProbeII)	9,600	19,200	28,800	1検体
	顕微レーザーラマン分光光度計 (JASCO NRS-4100)	3,800	7,500	11,300	1検体
	円二色性分散計(CD) (JASCO J-725)	3,400	6,800	10,200	1検体
	ダイナミック光散乱光度計 (Otsuka Electronics DLS-6000)	6,300	12,600	18,900	1検体
	分光エリプソメーター (HORIBA JOBIN YVON UVISEL ER AGMS-NSD)	5,600	11,100	16,700	1検体

業 務	共用設備 (メーカー名、型番)	利用料(円) (消費税を除く)			課金単位 (※6)
		学術研究機関	中小企業	大企業	
技術代行 (※1)	フェムト秒パルスレーザー(※5) (チタン：サファイア) (Coherent Mira 900)	13,800	27,600	41,400	1検体
	サブナノ秒パルスレーザー(窒素)(※5) (USHO KEC-160)				
	ストリークスコープ(※5) (HAMAMATSU C4780)				
	全自動元素分析装置 (PerkinElmer 2400ICHNS/O)	700	1,400	2,100	1検体
	示差走査熱量計・示差熱重量同時測定装置 (HITACHI DSC 7000X/STA 7200)	4,500	9,000	13,500	1検体
	熱/電気物性評価装置 (物性評価装置：PPMS) (Quantum Design PPMS EverCool II)	6,500	12,900	19,300	1検体
	大気中光電子分光装置 (RIKEN KEIKI AC-3)	1,300	2,500	3,700	1検体
	分光感度・内部量子効率測定装置 (BUNKOUKEIKI CEP-2000RP)	2,800	5,500	8,300	1検体
	微細形状測定装置 (Kosaka Laboratory ET200)	1,000	2,000	3,000	1検体
機器利用 (※2)	超高分解能電界放出型電子顕微鏡 (FE-SEM) (HITACHI SU9000)	3,500	6,900	10,300	1時間
	低真空分析走査電子顕微鏡 (HITACHI SU6600)	3,300	6,500	9,700	1時間
	微小デバイス特性評価装置 (nanoEBAC) (HITACHI NE4000)	22,500	45,000	67,500	1時間
	走査プローブ顕微鏡 (SPM) (HITACHI SPA400)	1,400	2,700	4,000	1時間
	MALDI-TOF-MS (Bruker autoflexII)	1,800	3,600	5,400	1時間
	600MHz超伝導NMR (JEOL JNM-ECA600)	2,600	5,200	7,800	1時間
	500MHz超伝導NMR (JEOL JNM-ECX500)	2,000	3,900	5,800	
	400MHz固体超伝導NMR(※4) (JEOL JNM-ECX400P)				
	二次イオン質量分析装置 (SIMS) (ULVAC-PHI ADEPT-1010)	3,000	5,900	8,900	1時間
	多機能走査型X線光電子分光分析装置 (XPS) (ULVAC-PHI PHI5000VersaProbeII)	1,100	2,100	3,100	1時間
	顕微レーザーラマン分光光度計 (JASCO NRS-4100)	1,300	2,500	3,800	1時間
	円二色性分散計 (CD) (JASCO J-725)	1,200	2,300	3,400	1時間
	ダイナミック光散乱光度計 (Otsuka Electorionics DLS-6000)	1,100	2,100	3,200	1時間
	分光エリプソメーター (HORIBA JOBIN YVON UVISEL ER AGMS-NSD)	1,900	3,700	5,600	1時間
	示差走査熱量計・示差熱重量同時測定装置 (HITACHI DSC 7000X/STA 7200)	1,200	2,300	3,400	1時間

業 務	共用設備 (メーカー名、型番)	利用料(円) (消費税を除く)			課金単位 (※6)
		学術研究機関	中小企業	大企業	
機器利用 (※2)	熱/電気物性評価装置 (物性評価装置: PPMS) (Quantum Design PPMS EverCool II)	1,000	2,000	3,000	1時間
	大気中光電子分光装置 (RIKEN KEIKI AC-3)	1,300	2,500	3,700	1時間
	分光感度・内部量子効率測定装置 (BUNKOUKEIKI CEP-2000RP)	900	1,800	2,700	1時間
	微細形状測定装置 (Kosaka Laboratory ET200)	1,000	2,000	3,000	1時間
協力研究 (※3)		50,000	100,000	150,000	1期・口
技術相談 (利用相談 は無料)		無料	1件あたり 最初の2時間まで10,000円 (原則1日につき1回2時間まで) 延長の場合は2時間毎15,000円 なお、上記以外に技術調査等の依頼 作業が発生する場合は別途実費を 申し受けます		

(※1) 技術代行において測定に立会いを希望される場合は作業に支障のない範囲で可能です。また、測定用試料の調製が必要な場合はそれにかかる経費を別途申し受ける場合がありますので事務局に御相談ください。

(※2) 機器利用の場合、本学の担当技術職員による講習を受けていただき、技術職員による利用許可を必要とします。講習は機器利用料金とは別途有料となりますので事務局に御相談ください。また、利用時間は装置の立ち上げ・立ち下げに係る時間を含みます。御利用時間は原則として平日の9時から17時までの間としております。

(※3) 協力研究は、一期3ヶ月の間、申し込み口数の1.5倍を越えない範囲で複数の機器を技術代行と機器利用を組み合わせてご利用いただける割安の料金制度です(どちらか一方でも可能です)。途中で流れが変わりうる研究開発にあつてユーザの皆様の利便性を向上させるべく組み入れた利用制度です。本学の担当技術職員等と相談の上、必要口数をお決めいただくことを推奨します。第1期(4月~6月)、第2期(7月~9月)、第3期(10月~12月)の3期を対象とし申請を受け付けております。通年での御利用を希望される場合は事務局に御相談ください。なお、本学共通機器としての性質上、計画に無理があると判断される場合は申し込み口数を制限させていただく場合があります。

(※4) 400MHz固体超伝導NMRは、液体サンプルは機器利用のみ可能、固体サンプルは技術代行のみ可能です。

(※5) フェムト秒パルスレーザー(チタン・サファイヤ)、サブナノ秒パルスレーザー(窒素)及びストリークスコープは、利用機器数にかかわらず、1検体あたりの料金です。

(※6) 技術代行における1検体は標準時間内料金です。標準時間は機器により異なりますので御相談ください。

(※7) TEM・SEMのご利用で試料調整が必要な場合は別途技術料を頂く事があります。詳細は事務局にご相談ください。

まずはご相談ください。

お申込み・問合せ先

国立大学法人

奈良先端科学技術大学院大学

物質科学教育研究センター

ナノテクノロジープラットフォーム事務局

〒630-0192 奈良県生駒市高山町 8916-5

(けいはんな学研都市)

TEL: 0743-72-6185

MAIL: nano-net@ms.naist.jp

<https://mswebs.naist.jp/nanopla/>



NAIST マスコットキャラクター NASURA (ナスラ)